



Abb. zeigt beispielhaft
 Z-Achsen Messsystem
 für Nikon Eclipse L200, L300

Z-Achsen Messsystem zur nachträglichen Ausstattung der Z-Achse von Nikon-Mikroskopen

Spezifikationen

Genauigkeit	±1 µm
Auflösung	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Signaltyp	MR/analog 5Vss
Anschluss	HD D-Sub 15-pol. Buchse (Anschluss an TANGO-Steuerung/Positionsanzeige)
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht / Abmessungen	Je nach Mikroskop unterscheiden sich konstruktiver Aufbau, Abmessungen und Gewicht des Z-Achsen Messsystems.

Bestellinformation

Z-Achsen Messsystem für	Bestell-Nr.
Eclipse LV100D, LV150	45-59-411-6000
Eclipse L200, L300	45-59-412-6000
Eclipse 80i	45-59-413-6000
Eclipse Ni-U	45-59-414-6000
Eclipse LV150N	45-59-415-6000
Eclipse LV150N ¹	45-54-417-0000

Produktmerkmale

- ▶ lineares Messsystem nanoScale² für höchste Genauigkeit
- ▶ ermöglicht in Verbindung mit einer TANGO-Steuerung³ den Closed-Loop-Betrieb der Z-Achse
- ▶ alternativ ist der Anschluss an die Positionsanzeige PROFILER SCD möglich
- ▶ stabile Befestigung ohne irreversible Modifikation des Mikroskops
- ▶ einfache Montage

Zubehör

Positionsanzeige PROFILER SCD
 Bestell-Nr.: 00-76-900-4830

Weiteres Zubehör für die Mikroskopie finden Sie unter: www.marzhauser.com